



反符合型平面硅探测器

Anti-coincidence Planar Silicon Detector

ANT 系列平面硅探测器

反符合表面钝化离子注入平面硅探测器 (PIPS) 是将两个面积相同的平面硅探测器叠层放置, 其中 A 探测器用于测量样品发射的 α 、 β 射线, B 探测器用于对测量环境中 γ 射线反符合, 降低其对 A 探测器测量本底的影响。



应用领域

- 环境放射性监测
- 辐射防护与监测
- α 、 β 总活度测量

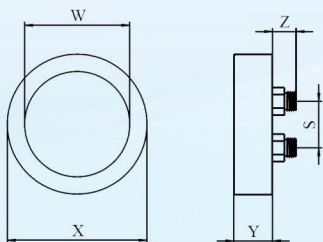
产品特点

- ◆ 兼容 SMA / Microdot 接口
- ◆ 良好的能量分辨率
- ◆ 信号反符合, 降低探测本底

有效面积 (mm ²)	分辨率 * keV (FWHM)		产品型号
	α	β	
300	18	13	BC-ANT-300
490	20	15	BC-ANT-490
620	21	16	BC-ANT-620
700	23	18	BC-ANT-700
950	28	23	BC-ANT-950
1200	32	27	BC-ANT-1200

* Alpha 分辨率测试条件: 真空度 < 60Pa, ²⁴¹Am @5.486MeV, 源距探测器为 2 倍探测器直径, 脉冲成型时间 1 μ s。

探测器外形尺寸



接口类型: 兼容 SMA / Microdot 接口

产品型号	外形尺寸 (mm)				
	W	X	Y	Z	S
BC-ANT-300	20.0	31.3	13.0	8.0	12.0
BC-ANT-490	25.0	36.3	13.0	8.0	18.0
BC-ANT-620	28.5	39.3	13.0	8.0	18.0
BC-ANT-700	30.0	42.3	13.0	8.0	18.0
BC-ANT-950	35.0	47.3	13.0	8.0	18.0
BC-ANT-1200	40.0	52.3	13.0	8.0	18.0
测量误差	± 0.2 mm				

北京百川微测科技有限公司

电话: 010-56694339

邮箱: sales@abpips.com

网址: www.abpips.cn

地址: 北京市昌平区昌平路 430 号金燕龙大厦 710



致力于提供高品质的核辐射探测解决方案



反符合型平面硅探测器

Anti-coincidence Planar Silicon Detector

ACAM 系列平面硅探测器



应用领域

- 环境放射性监测
- 辐射防护与监测
- 气溶胶 α 、 β 测量
- 带电粒子探测

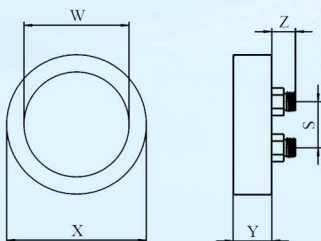
产品特点

- ◆ 腐蚀性环境下正常使用
- ◆ 允许环境光照下操作
- ◆ 信号反符合，降低探测本底

有效面积 (mm ²)	分辨率 * keV (FWHM)		偏置电压 (Positive)	Beta 阈值 (keV)	产品型号
	α	β			
490	38 34	18	15V - 24V 70V	54	BC-ACAM-490
700	42 35	20	15V - 24V 70V	62	BC-ACAM-700
950	44 38	25	15V - 24V 70V	66	BC-ACAM-950
1200	51 41	30	15V - 24V 70V	75	BC-ACAM-1200

* Alpha 分辨率测试条件：真空度 < 60Pa, ²⁴¹Am @5.486MeV, 源距探测器为 2 倍探测器直径, 脉冲成型时间 1 μ s.

探测器外形尺寸



接口类型：兼容 SMA / Microdot 接口

产品型号	外形尺寸 (mm)				
	W	X	Y	Z	S
BC-ACAM-490	25.0	36.3	13.0	8.0	18.0
BC-ACAM-700	30.0	42.3	13.0	8.0	18.0
BC-ACAM-950	35.0	47.3	13.0	8.0	18.0
BC-ACAM-1200	40.0	52.3	13.0	8.0	18.0
测量误差	± 0.2mm				

北京百川微测科技有限公司

电话：010-56694339

邮箱：sales@abpips.com

网址：www.abpips.cn

地址：北京市昌平区昌平路 430 号金燕龙大厦 710



致力于提供高品质的核辐射探测解决方案